© 2012 ІМФ (Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України) Надруковано в Україні. Фотокопіювання дозволено тільки відповідно до ліцензії

PACS numbers: 72.20.Jv, 72.80.Tm, 73.30.+y, 73.50.Gr, 73.50.Pz, 73.61.Wp, 83.60.La

# Фотоґенерація носіїв заряду в тонких плівках нанокомпозитів ПЕПК–С<sub>60</sub>

М. А. Заболотний, А. Ю. Сорока, О. П. Дмитренко, М. П. Куліш, Ю. М. Барабаш<sup>\*</sup>, М. О. Давиденко, С. Л. Студзинський, О. П. Оласюк, О. М. Рарата

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, вул. Володимирська, 64, 01033 Київ, Україна \*Інститут фізики НАН України, просп. Науки, 46, 03650, МСП, Київ-39, Україна

На даний час є недостатньо вивченими етапи процесу фотоґенерації носіїв заряду аморфних напівпровідників з домішками. Було досліджено фотоґенераційні властивості аморфних напівпровідників, допованих фуллеренами в різних концентраціях. Встановлено, що температура топлення композитів полі-N-епоксипропілкарбазолу (ПЕПК) з фуллеренами  $C_{60}$  зростає при збільшенні концентрації  $C_{60}$ . Спостерігалося збільшення ефективної температури при збільшенні концентрації  $C_{60}$ , що свідчить про участь  $C_{60}$  у формуванні Кулонових пасток у центрах фотоґенерації носіїв заряду. Значення ефективної температури топлення композитів ПЕПК +  $C_{60}$ .

The process stages of charge-carriers' photogeneration in amorphous semiconductors with impurities are under investigation until now. Photogeneration properties of amorphous semiconductors doped by fullerenes of various concentrations are studied. As revealed, the melting point of composites of poly-N-epoxypropylcarbazole (PEPC) with fullerene C<sub>60</sub> increases with growing C<sub>60</sub> concentration. Increase of effective temperature with growing C<sub>60</sub> concentration takes place, indicating the participation of C<sub>60</sub> in the formation of Coulomb traps in the centres of charge-carriers' photogeneration. The value of effective temperature coincides with the value of the melting temperature of PEPC–C<sub>60</sub> composites with an accuracy of 10%.

На данный момент недостаточно изученными являются этапы процесса фотогенерации носителей заряда аморфных полупроводников с примесями. Были исследованы фотогенерационные свойства аморфных полупроводников, допированных фуллеренами в разных концентрациях. Уста-

519

новлено, что температура плавления композитов поли-N-эпоксипропилкарбазола (ПЭПК) с фуллеренами  $C_{60}$  возрастает при увеличении концентрации  $C_{60}$ . Наблюдалось увеличение эффективной температуры при увеличении концентрации  $C_{60}$ , что свидетельствует об участии  $C_{60}$  в формировании кулоновских ловушек в центрах фотогенерации носителей заряда. Значение эффективной температуры с точностью в 10% совпадает со значением температуры плавления композитов ПЭПК +  $C_{60}$ .

Ключові слова: карбазол, фуллерен, фотоґенерація, ефективна температура.

(Отримано 8 липня 2011 р.)

## 1. ВСТУП

Величина квантового виходу фотоґенерації носіїв електричного заряду в світлочутливих органічних полімерних середовищах (ОПС) є базовою характеристикою, що визначає галузі їх застосування. При створенні фоточутливих середовищ для соняшних батерій, реверсивних шарів для реєстрації і аналізи дво- та тривимірної оптичної інформації, розробленні оптичних надчутливих сенсорів з підсиленням сиґналів за допомогою селективних плазмоннообумовлених електромагнетних полів цей параметер є визначальним. Зрозуміло, що значення квантового виходу фотоґенерації суттєво залежить від молекулярного складу і будови речовини. В органічних полімерних середовищах процес фотоґенерації є багатоступеневим і, згідно розповсюдженої точки зору [1–3], визначається особливостями будови фоточутливого середовища в околі центра фотоґенерації. У випадку, коли рухливість носіїв заряду різного знаку є суттєво різною за величиною (сенсибілізовані електронно-акцепторними домішками ПЕПК, ПВК) лінійні розміри області, де гемінальні заряди стають незалежними один від одного, близькі до Онзаґерового радіюса. З цього випливає, що силові поля, які детермінують процес відокремлення гемінальної електронно-діркової пари мають визначатися молекулярною будовою в околі центра фотоґенерації, комплексу з перенесенням заряду (КПЗ) або ексиплексу. Відокремлення електронно-діркової пари в таких середовищах має дифузійно-дрейфовий характер і, зазвичай, описується Онзаґеровим моделем або його варіянтами [2-5]. Провідність в цьому випадку має носити стрибкуватий характер. При такому підході не з'ясованою залишається природа ефективної температури [3], що визначає поведінку квантового виходу в області високих значень напружености електричного поля. Ще одним важливим фактором є те, що в моделях, які мають невелику кількість підгінних параметрів [6, 7], складно одержати числовий збіг між модельними і експериментальними значеннями часу та довжини термалізації, якщо не використовувати можливість суттєвого збільшення маси носія заряду за рахунок взаємодії його з оточенням. Таке використання ефективної маси носія заряду обумовлює обґрунтування адекватности елементів зонної теорії для опису органічних полімерних середовищ. Це, в свою чергу, вимагає наявности делокалізованих силових факторів, що погано корелює з допущенням суттєво просторово обмеженого характеру центра фотоґенерації. Таким чином, у загальному випадку, потрібно визначити: 1) від яких, локальних чи інтеґральних, характеристик речовини сенсибілізованого органічного полімерного середовища залежить процес фотоґенерації носіїв заряду, 2) залежність ефективної температури від будови та характеристик речовини.

Серед різноманітних полімерних матеріялів можна виділити важливий кляс π-спряжених карбазолвмісних органічних аморфних молекулярних напівпровідників.

При дослідженні фотовластивостей напівпровідників на основі органічних полімерних середовищ потрібно враховувати, що розподіл електронної густини основного та збуджених станів полімерних молекуль є різним, що призводить до різної сили їхньої взаємодії з зовнішнім електричним полем [1–3]. З аналізи цього явища та дослідження смуг вбирання можливо одержати інформацію про здатність молекуль до поляризації та про розподіл заряду в збуджених станах молекуль. Інформацію про ті ж локальні характеристики полімерних молекулярних систем може бути одержано при досліджені процесів фотоґенерації носіїв електричного заряду (електронів та дірок).

Метою роботи було дослідження залежности ефективної температури ( $T_0$ ) в шарах ПЕПК, леґованого фуллеренами С<sub>60</sub>, від концентрації допантів та встановлення кореляції між значенням  $T_0$  та температурою переходу речовини у в'язкоплинний стан.

#### 2. МЕТОДИКА ЕКСПЕРИМЕНТУ

Досліджувались зразки плівок ПЕПК з домішками фуллеренів  $C_{60}$ . При цьому враховувалось, що властивості нанокомпозитів визначаються не лише характеристиками складових частин, а й методою приготування [8]. Це загальне положення ілюструють спектри фотолюмінесценції зразків композита ПЕПК та  $C_{60}$ , одержаних методою поливу з толуольного розчину ПЕПК і  $C_{60}$ , а також одержаних за допомогою методи термічного вакуумного напорошення, які мають суттєві відмінності, Ця відмінність вказує на різний характер взаємодії в одержаних композитах, а отже, і різні їхні властивості та обумовлює необхідність детальної конкретизації технології одержання зразків.

Для приготування политих зразків попередньо виконувалося ро-

зчинення відомої кількости С<sub>60</sub> в нагрітому до температури 50°С толуолі. Після повного розчинення порошку фуллерену розчин зважувався, що дозволяло визначити його вагову і об'ємну концентрацію. При приготуванні зразків композитів використовувався порошок ПЕПК. Розчинення порошку ПЕПК у толуолі виконувалося без нагрівання. Одержані розчини змішувалися між собою в частинах вибраних таким чином, щоб концентрація композита була рівною 0, 0,5, 0,7, 2,5 та 3 ваг.%. За допомогою одержаних розчинів шляхом поливу на тверду основу виготовлялися плівки товщиною d = 0,9-1,2 мкм. Після поливу зразки висушувалися в термошафі при температурі 80°С на протязі 4 год. Твердою підкладкою були кварцові прямокутні пластини розмірами 1×2 см з нанесеним на поверхню напівпрозорим електропровідним шаром  $SnO_2$  з опором 30 Ом/см<sup>2</sup>. Шар аморфного молекулярного напівпровідника (АМН) наносився на пластину з боку SnO<sub>2</sub>, на вільну поверхню шару AMH наносився струмопровідний контакт зі срібної пасти.

Вимірювання оптичних спектрів вбирання виконувалися на спектрофотометрі «Specord M-40».

Зразки також використовувалися для вимірювань густини фотоструму при їх опроміненні монохроматичним світлом у видимому діяпазоні. Для опромінення зразків використовувалася лямпа розжарення з набором світлофільтрів. Інтенсивність світла в діяпазоні 0,2–5 Вт/м<sup>2</sup> змінювалася за допомогою невтральних світлофільт-



Рис. 1. Блок-схема устави для вимірювання температури топлення (1 шар тонкої плівки; 2 —  $\text{SnO}_2$ ; 3 — скло; 4 — вимірювальний зонд; 5 блок вимірювань потенціялу тонкої плівки; 6 — високовольтний ґенератор; 7 — блок ізотермічного нагріву тонкої плівки; 8 — лазер ЛГ-38; 9 — Фур'є-лінза; 10–15 — фотоприймачі).

рів. Напруженість електричного поля в плівках при прикладенні електричної напруги до контактів срібла і  $SnO_2$  вимірювалася в діяпазоні (1–20)·10<sup>7</sup> В/м. Кінетика струму під час опромінення і після вимкнення світла реєструвалася за допомогою запам'ятовчого осцилографа.

Температура топлення була виміряна за відомою оптичною методикою визначення реологічних характеристик тонких плівок [9]. Блок схема устави представлена на рис. 1.

Згідно використаної методики, шар середовища був електрично заряджений до передпробійної ріжниці потенціялів. При його нагріванні тонка плівка досягає температури переходу у в'язкоплинний стан, коли стає можливим утворення фазової дифракційної ґратниці на вільній поверхні зразка під дією пондеромоторних сил, що обумовлені електрокапілярним ефектом [9].

#### 3. РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Для вибору довжини хвилі збуджувального світла було виконано вимірювання оптичних спектрів вбирання зразків плівкових композитів ПЕПК + С<sub>60</sub> при кімнатній температурі. Результати вимірювань наведено на рис. 2.

Порівняння ліній 1 та 2 (рис. 2), що відповідають спектрам ПЕПК та ПЕПК з 0,5 ваг. % C<sub>60</sub> показує, що вплив домішок у малих концентраціях збільшує інтенсивність вбирання в короткохвильо-



**Рис. 2.** Спектри вбирання политих зразків на кварці для ПЕПК (1), ПЕПК з 0,5 ваг.% С<sub>60</sub> (2) та ПЕПК з 3 ваг.% С<sub>60</sub> (3) (джерело випромінення — воднева лямпа, температура — 300 К).



Рис. 3. Залежність темнового струму від прикладеного поля для зразка ПЕПК з 0,7 ваг. % С $_{60}.$ 



Рис. 4. Залежність темнового струму від прикладеного поля для зразка ПЕПК з 2,5 ваг. %  $C_{60}$ .

вій ділянці спектру ( $\lambda < 375$  нм) та не впливає на характер вбирання в довгохвильовій області ( $\lambda > 375$  нм). Це може свідчити про адитивний характер вбирання складових композита. При збільшенні концентрації домішки (не менше 1 ваг.%) спектри вбирання суттєво змінюються: виникає широка розмита смуга в області довжин хвиль  $\lambda > 375$  нм. Це може свідчити про участь димерів у формуванні нових центрів вбирання, які відповідають за вбирання в області  $\lambda > 375$  нм. [10]. Поява смуг у нанокомпозиті ПЕПК з фуллеренами, які нехарактерні для чистого ПЕПК і чистого  $C_{60}$  [11], зазвичай пояснюється утворенням комплексів з перенесенням заряду в системі ПЕПК +  $C_{60}$ [12, 13]. Виникнення цих комплексів має призводити до появи енергетичних рівнів, що формують зони стрибкового транспорту носіїв заряду [14].

Використання описаних зразків для виконання досліджень об'ємнообумовлених процесів фотопровідности та пов'язаного з нею квантовим виходом фотоґенерації вимагала відокремлення темнових, інжекційних та фотостимульованих процесів, які визначають густину струму шару АМН (j(E)) у відповідності до наступного рівнання [15]:

$$j(E) = j_{\text{TEMH}}(E) + j_{\phi}(E),$$
 (1)

де  $j_{\text{темн}}(E)$  — густина інжекційного та термопольового струму;  $j_{\phi}(E)$  — густина фотоструму.

Виміри густини струму в зразках ПЕПК, допованих C<sub>60</sub>, були виконані при вимкненому освітленні. Результати цих вимірів для зразка ПЕПК з 0,7 ваг.% C<sub>60</sub> представлено на рис. 3, а для зразка з вмістом 2,5 ваг.% C<sub>60</sub> показано на рис. 4. Значення густини струму між напорошеними контактами в загальному випадку визначалося термопольовою ґенерацією носіїв заряду та інжекційними процесами з металу в шар АМН. З наведених даних видно, що при  $E > 5 \cdot 10^7$  В/м густина фотоструму слабко залежить від напружености електричного поля, що може свідчити про домінантну роль процесів термопольової ґенерації носіїв заряду; польова залежність інжекційних струмів має описуватись експоненційним співвідношенням типу Річардсона–Шотткі [1, 3].

У подальшому виконувались виміри густини струму (j(E)) в зразках при їхньому освітленні, і за допомогою співвідношення (1) визначалося значення  $j_{\Phi}(E)$ .

Виконані дослідження залежности густини фотоструму ( $j_{\Phi}(E)$ ) в зразках сандвіч структур SnO<sub>2</sub>–ПЕПК + C<sub>60</sub>–Al від товщини плівки (d) в інтервалі 0,9–1,2 мкм показали його пропорційність товщині зразка та інтенсивності збуджувального світла в діяпазоні напруженостей електричного поля  $10^7-10^8$  В/м, що підтверджує його об'ємнообумовлений характер.

На рисунках 3 та 4 спостерігається нелінійне зростання густини темнового струму при збільшенні концентрації С<sub>60</sub>, що можливо вказує на кластеризацію молекуль фуллеренів у процесі формування твердих композитів на основі органічної полімерної матриці.

Виконані дослідження залежності густини фотоструму від інтенсивности збуджувального світла показали існуючий між ними пропорційний зв'язок, що ілюструє рис. 5.



**Рис. 5.** Залежність фотоструму для зразку ПЕПК + 2 ваг. %  $C_{60}$  від інтенсивності збуджувального світла у випадку різних значень напружености поля.

З даних, наведених на рис. 5, випливає, що процес фотоґенерації є лінійним залежно від величини інтенсивности світла. Це вказує на відсутність взаємного впливу центрів фотоґенерації.

Для подальшої аналізи густини фотоструму можна скористатися тим, що залежність густини фотоструму (а також ефективности та квантового виходу фотоґенерації) від напружености прикладеного поля описується наступним чином [3, 15, 16]:

$$j_{\Phi}(E) = j_{\Phi}^{0} \exp\left[\frac{\beta_{\Pi\Phi}\sqrt{E}}{k_{B}}\left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_{0}}\right)\right],$$
(2)

де  $j_{\Phi}^{0}$  — густина фотоструму, що слабо залежить від E,  $\beta_{\Pi\Phi} = \sqrt{\frac{q^{3}}{\pi\varepsilon\varepsilon_{0}}}$ 

— стала Пула-Френкеля; T — температура;  $T_0$  — ефективна температура;  $\varepsilon$  — діелектрична проникність середовища;  $k_B$  — Больцманнова стала. Таке представлення добре описує особливості поведінки густини фотоструму раніше досліджених зразків фуллеренвмісних полімерів з різними сенсибілізаторами [1, 3, 15, 16]. Для аналізи експериментальних досліджень було використано значення  $\ln(j_{\Phi}(E))$ , яке можна записати наступним чином:

$$\ln j_{\Phi}(E) \cong \sqrt{E} \, \frac{\beta_{\Pi \Phi}}{k_B} \left( \frac{1}{T} - \frac{1}{T_0} \right). \tag{3}$$

Як видно з означення сталої Пула–Френкеля, її значення залежить від величини діелектричної проникности середовища. Для тонкоплівкових композитів ПЕПК з С<sub>60</sub>, одержаних за допомогою поливу з толуольного розчину, цей параметер не є точно визначеним. Тому значення сталої Пула–Френкеля було розраховано для декількох значень діелектричної проникности  $\varepsilon = 3$ , 3,5 та 4. На основі цих розрахунків було одержано залежність добутку сталої Пула–Френкеля на ріжницю оберненої температури і оберненої ефек-

тивної температури  $\left(\gamma = \frac{\beta_{\Pi\Phi}}{k_{\rm B}} \left[\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0}\right]\right)$  від величини ефективної те-

мператури  $T_0$ , тобто величини, що визначає кут нахилу залежности  $\ln j_{\Phi}(E)$ . Ці дані представлено на рис. 6.

З рисунка 6 видно, що кут нахилу залежности  $\ln j_{\Phi}(E)$  суттєво залежить як від діелектричної проникности середовища, так і від  $T_0$ . Використовуючи значення діелектричної проникності  $\varepsilon = 3$ , яке близьке до відповідної величини  $\varepsilon$  для чистого ПЕПК [3], було розраховано теоретичну залежність  $\ln j_{\Phi}(E)$ для зразків ПЕПК з різною концентрацією фуллеренів. Крім того, виконано порівняння розрахованих та експериментальних результатів залежностей  $\ln j_{\Phi}(E)$ . Кут нахилу теоретичної залежности  $\ln j_{\Phi}(E)$  змінювався за рахунок зміни  $T_0$ . Значення  $T_0$  вибиралося таким чином, щоб середньоквадратична ріжниця між теоретичною і експериментальною кривою була найменшою. Результати такого зіставлення у випадку нанокомпозитів ПЕПК-С<sub>60</sub> з вмістом фуллеренів 0,7 ваг.% наведено на рис. 7, а для концентрації 2,5 ваг.% С<sub>60</sub> представлено на рис. 8. Скориставшись експериментальними та теоретичними результатами, визначили ефективну температуру  $T_0$  для обох зразків.

З наведених даних видно, що спостерігається збільшення ефективної температури для зразків ПЕПК при збільшенні вмісту  $C_{60}$ , що може свідчити про зменшення ролі тунельних процесів при відокремленні електрон-діркової пари та про участь  $C_{60}$  у формуванні Кулонових пасток у центрах фотоґенерації носіїв заряду [4].

На рисунку 9 наведено результати вимірювань температури переходу у в'язкоплинний стан ( $T_{nn}$ ) для зразків ПЕПК з 0; 0, 7; 2, 5; та 3 ваг.% С<sub>60</sub>. З рисунку 9 видно, що температура переходу нанокомпозитів ПЕПК-С<sub>60</sub> у в'язкоплинний стан збільшується при зростанні концентрації С<sub>60</sub>. При підвищенні вмісту фуллеренів С<sub>60</sub>, температура  $T_{nn}$  зростає, що свідчить або про покращення міжмолекулярної взаємодії, або про утворення твердих недеформованих наноструктур з участю С<sub>60</sub>, розміри яких залежать від концентрації фуллерену [17]. Важливо відмітити, що значення температури переходу композитів у в'язкоплинний стан  $T_{nn}$  з точністю до 10% збігається зі значеннями ефективної температури ( $T_0 \approx T_{nn}$ ). Це може свідчити про те, що або 1) ефективна температура, як і температура то528



**Рис. 6.** Залежність параметра у при кімнатній температурі від величини ефективної температури для різних значень діелектричної проникности є.



Рис. 7. Залежність теоретичного (суцільна лінія) та експериментального (маркери) значення логаритму фотоструму від напружености прикладеного поля для зразка ПЕПК з 0,7% С<sub>60</sub> діелектричної проникности  $\varepsilon = 3$ , температури у 300 К та значення ефективної температури у 360 К.

плення, визначається силами міжмолекулярної взаємодії нанокомпозита, або 2) обидві характеристики обумовлюються процесами коаґуляції С<sub>60</sub> в полімерній матриці.



Рис. 8. Залежність теоретичного (суцільна лінія) та експериментального (маркери) значення логаритму фотоструму від напружености прикладеного поля для зразка ПЕПК з 2,5% С<sub>60</sub> діелектричної проникности  $\varepsilon$ =3, температури у 300 К та значення ефективної температури у 380 К.



**Рис. 9.** Залежність температури переходу нанокомпозитів ПЕПК-С<sub>60</sub> у в'язкоплинний стан від концентрації фуллеренів.

## 4. ВИСНОВКИ

1. При малих концентраціях фуллеренів у матриці ПЕПК (менше 0,5 ваг.%) спектер вбирання у видимій області формується незале-

жними оптичними переходами ПЕПК та С<sub>60</sub>. При збільшені концентрації допанту С<sub>60</sub> (більше 1 ваг.%) у композитах ПЕПК з фуллеренами з'являються нові смуги. Такий нелінійний характер впливу концентрації С<sub>60</sub> може свідчити про домінантний характер взаємодії молекуль ПЕПК з димерами С<sub>60</sub>.

2. Залежність густини об'ємно ґенерованого фотоструму від напружености електричного поля в плівках ПЕПК + С<sub>60</sub> узгоджується з модифікованим законом Пула-Френкеля, що вказує на стрибкуватий механізм транспорту носія заряду під час процесу його фотоґенерації.

3. Модифікована стала Пула-Френкеля залежить від концентрації С<sub>60</sub>, що свідчить про зміну локальної діелектричної проникности в околі центра фотоґенерації при зміні концентрації С<sub>60</sub>.

4. Значення ефективної температури нанокомпозитів ПЕПК з фуллеренами  $C_{60}$  зростає при збільшенні вмісту  $C_{60}$ , що свідчить про зменшення ролі тунельних процесів при відокремленні електрондіркової пари та участь фуллеренів у формуванні Кулонових пасток у центрах фотоґенерації носіїв заряду.

5. Температура топлення композитів ПЕПК +  $C_{60}$  залежить від концентрації  $C_{60}$  — при збільшенні концентрації вона зростає, що свідчить про покращення міжмолекулярної взаємодії або про утворення твердих недеформованих наноструктур за участю  $C_{60}$ .

6. Значення характеристичної температури з точністю у 10% збігається із значенням температури топлення нанокомпозита ПЕПК +  $C_{60}$ , що вказує на залежність ефектів фотоґенерації носіїв заряду та топлення від однакових процесів.

## ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА

- 1. M. Pope and C. E. Swenberg, Annual Review of Physical Chemistry, 35: 613 (1984).
- 2. Э. Силиныш, М. Курик, В. Чапек, Электронные процессы в органических молекулярных кристаллах (Рига: Зинатне: 1988).
- 3. Н. Г. Кувшинский, Н. А. Давиденко, П. М. Комко, Физика аморфных молекулярных полупроводников (Киев: Лыбедь: 1994).
- М. А. Заболотный, А. Г. Загородний, Н. П. Боролина, Физика твердого тела, 33, № 8: 2345 (1991).
- 5. М. А. Заболотный, Н. П. Кулиш, О. П. Дмитренко, Е. С. Кобус, Ю. М. Барабаш, *Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології*, **6**, № 4: 1043 (2008).
- Ю. М. Барабаш, М. А. Заболотний, М. П. Куліш, В. М. Харкянен, О. П. Дмитренко, О. С. Кобус, Фізика і хімія твердого тіла, 10, № 2: 258 (2009).
- 7. N. P. Kulish, Yu. M. Barabash, M. A. Zabolotny, D. A. Grinko, O. P. Dmitrenko, and E. S. Kobus, *Physics of the Solid State*, **50**, No. 7: 1374 (2008).
- 8. И. П. Суздалев, Нанотехнология: физико-химия нанокластеров, наноструктур и наноматериалов (Москва: Комкнига: 2006).
- 9. Ю. М. Барабаш, М. С. Бородкина, И. А. Малахова, Н. А. Маршак, Фунда-

# ФОТОҐЕНЕРАЦІЯ НОСІЇВ ЗАРЯДУ В ПЛІВКАХ НАНОКОМПОЗИТІВ ПЕПК-С $_{60}\,\,531$

ментальные основы оптической памяти и среды, 15:9 (1984).

- 10. Т. Л. Макарова, Физика и техника полупроводников, 35, № 3: 257 (2001).
- 11. W. Zhao, T. N. Zhao, J. J. Yue, L. Q. Chen, and J. Q. Liu, *Solid State Communications*, 84, No. 3: 323 (1992).
- М. А. Заболотный, Е. С. Кобус, О. П. Дмитренко, Н. П. Кулиш, Н. М. Белый, Е. В. Стасюк, Ю. М. Барабаш, Г. И. Довбешко, Е. М. Фесенко, Ю. П. Пирятинский, Д. А. Гринько, Физика твердого тела, 52, № 4: 826 (2010).
- 13. Е. Л. Александрова, Физика и техника полупроводников, **38**, № 10: 1153 (2004).
- 14. В. Ф. Гантмахер, Электроны в неупорядоченных средах (Москва: Физматлит: 2005).
- 15. Н. Г. Кувшинский, Н. Г. Находкин, М. А. Заболотный, В. М. Комко, Украинский физический журнал, 28, № 11: 1729 (1983).
- 16. V. Gulbinas, D. Hertel, A. Yartsev, and V. Sundström, *Physical Review B*, **76**: 235203\_1 (2007).
- 17. Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц, *Теоретическая физика*. Т. 6. Гидродинамика (Москва: Физматлит: 2003).